 arch No	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/614,217	CHA, ELLIS T.
Examiner	Art Unit
Tianjie Chen	2652

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
Updated			
		,	
-,			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			,

INT	ERFERENC	FERENCE SEARCHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
,,,			
			ļ.

(INCLUDING SEAR		T
	DATE	EXMR
AMAS		
•		